

01; 06.3; 07

© 1992

ОПТИЧЕСКАЯ БИСТАБИЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ ФОТОГЕНЕРИРОВАННЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Ю.Н. Карамзин, С.В. Поляков,
В.А. Трофимов

В последние годы внимание многих авторов привлекает проблема оптической бистабильности (ОБ) [1-6] в связи с возможностью оптической обработки и хранения информации. К настоящему времени предложены несколько типов ОБ: абсорбционная, дисперсионная и абсорбционно-дисперсионная. Поиск других механизмов ОБ представляет собой актуальную задачу, так как, возможно, они окажутся более предпочтительными для практической реализации, например по температурному диапазону. В настоящем сообщении предложен новый тип ОБ (назовем ее релаксационной ОБ), основанный на температурной зависимости времени релаксации фотовоизбужденных заряженных частиц, который в сочетании с нелинейной зависимостью коэффициента поглощения может привести к мультистабильности.

Рассматриваемый процесс взаимодействия светового импульса с полупроводником при определенных условиях описывается следующей системой безразмерных уравнений:

$$\frac{\partial I}{\partial z} = -\delta_o \delta(n, T) I, \quad 0 < z < 1,$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial n}{\partial z} \right) + \delta(n, T) I - n \left(1/\tau_p(T) + 1/\tau_D \right), \quad (1)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\alpha \frac{\partial T}{\partial z} \right) + qn/\tau_p(T) - (T - T_0), \quad t > 0$$

с начальными и граничными условиями

$$I|_{z=0} = I_c f(t), \quad n|_{t=0} = \tilde{n}_o, \quad T|_{t=0} = \tilde{T}_o, \quad (2)$$

$$\frac{\partial n}{\partial z} \Big|_{z=0,1} = \frac{\partial T}{\partial z} \Big|_{z=0,1} = 0.$$

В (1, 2) I – нормированная интенсивность с пиковым значением I_c и начальной формой импульса $f(t)$, z – продольная координата, измеряемая в длинах кристалла L_z , δ_o – линейный коэффициент поглощения полупроводника на длине L_z , $\delta(n, T)$ – его нелинейная зависимость от измеряемой относительно равновесного значения концентрации электронов в зоне проводимости n , нормированной на ее максимально возможное значение, и от температуры T , выраженной в единицах температуры T_g , характеризующей ширину запрещенной зоны при равновесной температуре T_o , время t нормировано на время τ_r отвода тепла из области пучка вследствие поперечной диффузии, D и α – коэффициенты диффузии заряда и теплопроводности, $\tau_p(T)$ – температурная зависимость времени безызлучательной рекомбинации электронов, нормированная на τ_r , поперечная диффузия учитывается в (1) стоковыми членами, q – отношение максимально возможной при релаксации заряда температуры кристалла к T_g , $\tilde{\tau}_o$ и \tilde{T}_o – начальные значения τ и T .

Для определенности коэффициент поглощения и температурная зависимость времени релаксации аппроксимировались в виде

$$\delta(n, T) = (1-n) \exp\left\{-1/T\right\}, \quad \tau_p(T) = \tau_{pm} \left[1 - \tau + \tau \cdot \exp\left\{-(T - T_p)^2\right\} \right], \quad (3)$$

где τ , T_p , τ_{pm} – положительные константы.

Как показывает анализ точечной модели, в приближении тонкого нелинейного слоя ($\delta_o \ll 1$) и в пренебрежении влиянием поперечной диффузии заряда ($\tau_D = \infty$) необходимым условием существования бистабильности будет наличие нескольких корней \tilde{T}_k ($k = 1, 2, \dots$) уравнения

$$\tau^2 - (T - T_o) + (T - T_o)^2 \cdot q^{-1} \cdot \left[\tilde{\tau}'_p(T) \cdot \tau^2 + \tilde{\tau}_p(T) \right] = 0 \quad (4)$$

в области

$$T \geq T_o, \quad 1 - (T - T_o) \cdot \tilde{\tau}_p(T) / q > 0. \quad (5)$$

Значение \tilde{T}_k соответствуют следующие значения концентрации n и падающей интенсивности I_c :

$$n_k = (\tilde{T}_k - T_o) \cdot \tilde{\tau}_p(\tilde{T}_k) / q, \quad I_{c,k} = (\tilde{T}_k - T_o) / [\delta(n_k, \tilde{T}_k) \cdot q], \quad (6)$$

Напомним, что при постоянном времени релаксации $\tilde{\tau}_p(T) \equiv \tilde{\tau}_{pm}$ реализуется чисто абсорбционная ОБ, если начальная температура T_o не превышает некоторого значения $T_o^*(\bar{q}) < 0.25(\bar{q} = q/\tau_{pm})$ и справедливо неравенство $\bar{q} > \bar{q}^*$. На рис. 1 этому случаю на плоскости (T_o, \bar{q}) соответствует объединение областей 1, III, IV.

Для полупроводников с зависимостью $\tilde{\tau}_p(T)$ возможен новый тип ОБ. Так, для случая $\tilde{\tau}_p = T_o$, соответствующего часто встречающейся на практике спадающей зависимости $\tilde{\tau}_p(T)$, при $\bar{q} \geq 0.65$

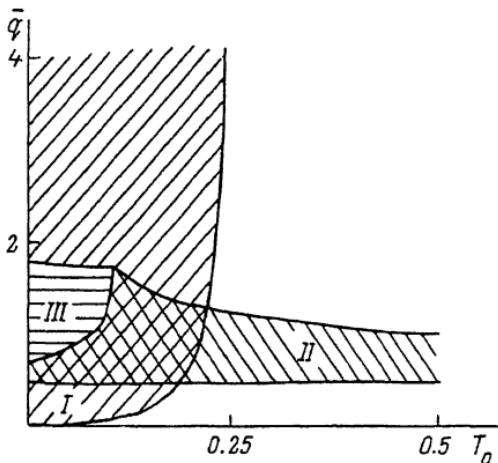


Рис. 1. Области реализации ОБ в плоскости параметров (T_0, \bar{q}) в случае совпадения начальной температуры T_0 с центром \bar{T}_p температурной зависимости времени релаксации зарядов $\tau_p(T)$ для $\tau = 0.9$. Различной штриховкой и цифрами I, II, III и IV обозначены соответственно области абсорбционной, релаксационной, смешанной бистабильности и мультистабильности.

уравнение (4) может иметь до четырех корней в области, определенной в (5) (см. рис. 1). Существенно, что два из них реализуются при $T_0 > T_0^*$, т.е. когда нет абсорбционной ОБ (область II на рис. 1). Для $T_0 < T_0^*$ в зависимости от величины \bar{q} реализуется бистабильность или мультистабильность (области 111 и 1У рис. 1), диапазон существования которой сильно зависит от значения τ . Так, для $\tau = 0.7$ этот интервал по \bar{q} совпадает с $(0.56, 0.62)$, а для $\tau = 0.9$ имеем $(0.47, 1.62)$. При этом с ростом максимально возможного разогрева полупроводника \bar{q} нижняя граница области мультистабильности сдвигается в сторону больших начальных температур. Реализация же абсорбционной ОБ слабо зависит от времени релаксации $\tau_p(T)$ при $\bar{q} \geq 1$.

Релаксационная ОБ приводит к новому качеству стационарных зависимостей $T(I_c)$, $n(I_c)$ и $I_{\text{вых}}(I_c) = I_c \cdot \exp\{-\delta(n(I_c), T(I_c))\}$, которые, например, для $\bar{q} = 0.9$, $\tau = 0.9$, $T_0 = 0.04, 0.16, 0.28$ (кривые 1-3) имеют вид, как показано на рис. 2. Отметим, что в первом случае нижняя ветвь каждой стационарной зависимости соответствует абсорбционной, а верхняя – релаксационной ОБ (такая, смешанная, ОБ реализуется в области 111, см. рис. 1). Во втором случае каждый механизм ОБ порождает свою пару устойчивых ветвей, и возникает мультистабильность. В третьем имеет место только релаксационная ОБ, требующая для своей реализации несколько меньших интенсивностей I_c , чем абсорбционная ОБ.

Для полноты анализа и, учитывая возможность возрастания в реальных условиях на каком-то интервале температур времени $\tau_p(T)$, рассмотрим ситуацию $\bar{T}_p > T_0$. Тогда с ростом \bar{T}_p область реализации релаксационной ОБ по τ по \bar{q} расширяется, и почти

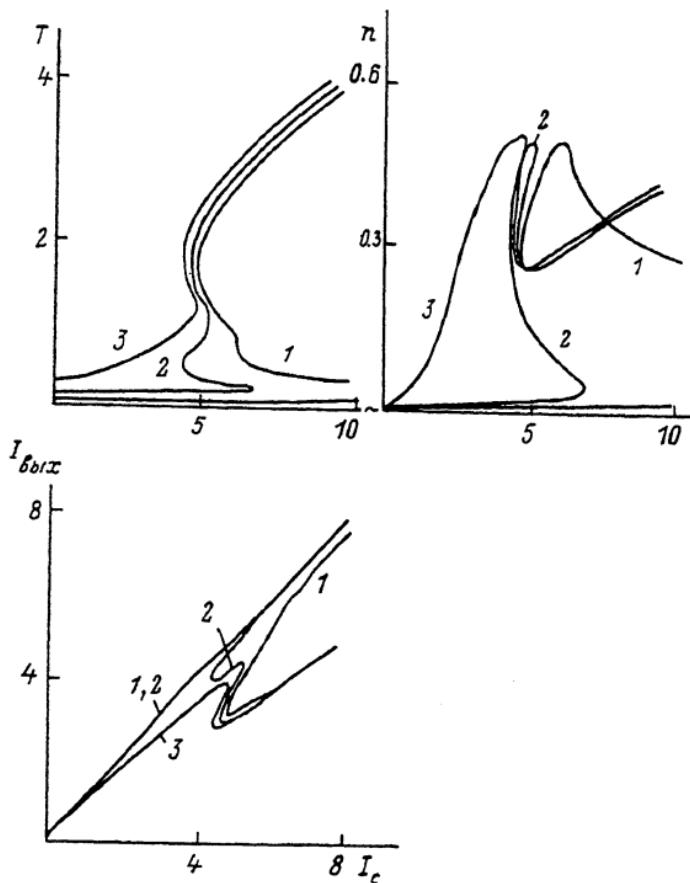


Рис. 2. Стационарные зависимости температуры, концентрации и выходной интенсивности от амплитуды падающего излучения I_c для параметра среды $\delta_o = 1$, $\bar{\gamma} = 0.9$, $\tau = 0.9$, $T_p = T_o = 0.04$, 0.16 , 0.28 (кривые 1–3).

линейно увеличивается минимальная температура T_o (см. рис. 3). При этом критические значения температуры располагаются выше T_p и отвечают большим интенсивностям, чем в случае абсорбционной ОБ.

В заключение отметим, что в анализируемой выше ситуации взаимодействия лазерного излучения с полупроводником возможна реализация периодических режимов выходной интенсивности светового импульса [6], имеющих бифуркационную природу, а также образование пространственных волн переключения.

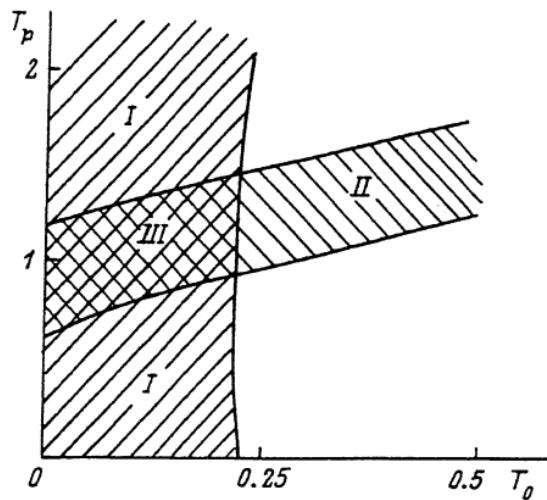


Рис. 3. Области реализации ОБ в плоскости параметров (T_0, T_p) для $\bar{q} = 1.5, \tau = 0.6$. Различной штриховкой и цифрами I, II и III обозначены соответственно области абсорбционной, релаксационной бистабильности и мультистабильности.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Гиббс Х. Оптическая бистабильность. М.: Мир, 1988. 520 с.
- [2] Днепровский В.С. et al. // Phys. Stat. Sol. B. 1988. V. 146. N 1. P. 341-350.
- [3] Rosanov N.N. et al. // JOSA. B. 1991. V. 8. N 7. P. 1471-1476.
- [4] Стадник В.А. // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 49. Вып. 11. С. 633-636.
- [5] Парканский Б.Ш., Ротару А.Х. // ЖЭТФ. 1991. Т. 99. Вып. 3. С. 899-910.
- [6] Карамзин Ю.Н., Поляков С.В., Трофимов В.А. // Письма в ЖТФ. 1992. Т. 18. Вып. 9.

Поступила в Редакцию
30 ноября 1992 г.